財團法人工業技術研究院 函

地址:310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人:鍾嘉芸 電話:03-5912685

E-mail: eldachung@itri.org.tw



109001206305

10846 台北市長沙街 2 段 73 號 3 樓

受文者:台北市儀器商業同業公會

發文日期:中華民國 109 年 07 月 03 日 發文字號:工研轉字第 1090012063 號

速別:普通件 密等:無 附件:如文

主旨:本院擬舉辦「109 年度工研院生理量測、前瞻檢測、軟性 電子檢測及精微製程檢測專利」非專屬授權公開說明會, 敬請轉知貴會會員,把握機會參與本次推廣活動,請查 照。

說明:

- 一、為提昇國內廠商智慧財產權之能量,本院將舉辦「109年 度工研院生理量測、前瞻檢測、軟性電子檢測及精微製程 檢測專利(68 案 135 件)」之非專屬授權公開說明會(授權 標的詳如附件)。
- 二、本案「授權標的」共分為以下 4 個類別: (一) 生理量測 (共計 17 案 46 件)、(二) 前瞻檢測(共計 11 案 19 件)、(三) 軟性電子檢測(共計 18 案 34 件)、以及(四) 精微製程檢測(共計 22 案 36 件)。
- 三、有關本活動詳細資訊,請參考下列網站公告:工研院研發 成果公告網站

(https://itriwww.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=01_content&SiteID=1&MmmID=1036461244216621372&MGID=1072147520101537562)

四、非專屬授權廠商資格:國內依中華民國法令組織登記成立 且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

五、公開說明會:

- (一)舉辦時間:民國(以下同)109年7月22日上午1 0時至11時。
- (二)舉辦地點:新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110-1 室。
- (三)報名須知:採電子郵件方式報名。有意報名者,請於109年7月21日中午12時整(含)前,以電子郵件向本案聯絡人報名(主旨請註明「109年度工研院生理量測、前瞻檢測、軟性電子檢測及精微製程檢測專利非專屬授權:公開說明會報名」,並於內文中註明:公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱)。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於109年07月21日下午5時整(含)前,發送電子郵件回覆,並告知公開說明會會議資訊。

六、本案聯絡人:

工研院技術移轉與法律中心 鍾小姐

電話: +886-3-591-2685

傳真: +886-3-582-0466

電子信箱:eldachung@itri.org.tw

地址:310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110

室

正本受文者: 台北市儀器商業同業公會

院長 多八

依權責劃分規定授權業務主管決行



109年度工研院生理量測/前瞻檢測/軟性電子檢測及 精微製程檢測專利非專屬授權公告

- 一、 主辦單位: 財團法人工業技術研究院(以下簡稱「工研院」)。
- 二、 非專屬授權標的:生理量測/前瞻檢測/軟性電子檢測及精微製程檢測專利 68 案 135 件,詳細資訊請參「附件:非專屬授權標的清單」。
- 三、非專屬授權廠商資格:國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、 設計、製造或銷售之公司法人。

四、公開說明會

- 1、 舉辦時間:民國(下同)109年7月22日上午10時至11時。
- 2、 舉辦地點:新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110-1 室。
- 3、報名須知:採電子郵件方式報名。有意報名者,請於109年7月 21日中午12時整(含)前發送電子郵件(主旨上註明「生理量測 /前瞻檢測/軟性電子檢測及精微製程檢測專利非專屬授權公開 說明會報名」,並於內文中陳明:公司名稱、公司電話、參與人數、 姓名、職稱。)向本案聯絡人報名。工研院「技轉法律中心」聯絡 人將於109年7月21日下午5時整(含)前發送電子郵件回覆並 告知公開說明會會議資訊。

五、 本案聯絡人:

工研院「技轉法律中心」 鍾小姐

電話:+886-3-591-2685, 傳真:+886-3-582-0466

電子信箱:eldachung@itri.org.tw



Industrial Technology Research Institute

地址: 310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

附件:「非專屬授權標的清單」

(一) 生理量測

				國					類	委辨
案	件	件編號	專利名稱	家	狀態	申請案號	專利起期	專利迄期	型	單位
1	1	D070000107W	嬰幼兒生理監視與安	TNW	JAP 1,00	100149951	00151011	00011104	發	經濟部
1	1	P07000019TW	撫裝置	TW	獲證	100143351	20151011	20311124	明	技術處
2	2	P07000020TW	可攜式嬰幼兒監視裝	TW	獲證	100143384	20150121	20311124	發	經濟部
2	7	1070000201#	置	1 11	1500	100145564	20130121	20311124	明	技術處
3	3	P07000021TW	無線量測睡眠深度的	TW	獲證	100142046	20150121	20311116	發	經濟部
	J	1010000211#	裝置與方法	1"	1X 02	100112010	20100121	20011110	明	技術處
	4	P07000028TW	雷達波感測裝置及方	TW	獲證	100145152	20140401	20311206	發	經濟部
4			法	- "					明	技術處
	5	P07000028US	雷達波感測裝置及方	US	獲證	13/491, 813	20140909	20330225	發	經濟部
			法						明	技術處
	6	P07010004CN	生理測量系統及其方	CN	獲證	201310135757.7	20160706	20330417	發	經濟部
5			法						明	技術處
	7	P07010004TW	生理量測系統及其方	TW	獲證	102111096	20160121	20330327	發	經濟部
			法						明	技術處
	8	P07010010CN	雙頻耦合饋入天線以	CM	43£ 244	901910990944 F	90100595	90990990	發	經濟部
	ŏ	P07010010CN	及使用該天線的可調 式波束模組	CN	獲證	201310389844.5	20160525	20330829	明	技術處
			式 成 不 供 組							
			叉極化天線以及使用						發	經濟部
6	9	P07010010TW	該天線的可調式波束	TW	獲證	101131577	20151211	20320829	明明	技術處
			模組							22
			雙頻耦合饋入天線、交							
			叉極化天線以及使用						發	經濟部
	10	P07010010US	該天線的可調式波束	US	獲證	13/674, 909	20160315	20340702	明	技術處
			模組							
	1.1	D0701000177	電子裝置與物體活動	TNU	مود خطر	101145104	00141011	00001100	發	經濟部
7	11	P07010021TW	狀態感測方法	TW	獲證	101145184	20141211	20321129	明	技術處
7	10	D07010001UC	電子裝置與物體活動	IIC	举 1 %	19/749 910	90150015	90991194	發	經濟部
	12	P07010021US	狀態感測方法	US	獲證	13/743, 319	20150915	20331124	明	技術處
8	13	P07010027TW	脈波雷達測距裝置及	TW	獲證	101147273	20150421	20321212	發	經濟部



			I							. 1
			其測距演算法						明	技術處
	14	P07010027US	脈波雷達測距裝置及	US	獲證	13/831, 894	20160119	20340512	發	經濟部
			其測距演算法		12.12				明	技術處
9	15	P07010044TW	訊號處理方法及訊號	TW	獲證	102105867	20170501	20330219	發	經濟部
9	10	1010100441#	處理系統	1"	泛证	102103001	20170301	20000219	明	技術處
	1.0	D0700001FDE	生理量測的感測系統	DE	73¢ 20¢	ED14170470 0	00100000	00040704	發	經濟部
	16	P07020015BE	與方法	BE	獲證	EP14178472.8	20160309	20340724	明	技術處
	1.5	Dogo co el Fav	生理量測的感測系統	GN.	مدر طفر	201410411455	20151024	20240010	發	經濟部
	17	P07020015CN	與方法	CN	獲證	201410411457.1	20171024	20340819	明	技術處
			生理量測的感測系統						發	經濟部
	18	P07020015DE	與方法	DE	獲證	EP14178472.8	20160309	20340724	明	技術處
			生理量測的感測系統						發	經濟部
	19	P07020015DK	與方法	DK	獲證	EP14178472.8	20160309	20340724	明	技術處
10			生理量測的感測系統						發	經濟部
	20	P07020015FR	與方法	FR	獲證	EP14178472.8	20160309	20340724	明	技術處
			生理量測的感測系統						發	經濟部
	21	P07020015GB	與方法	GB	獲證	EP14178472.8	20160309	20340724	明	技術處
			生理量測的感測系統						發	經濟部
	22	P07020015JP	與方法	JP	獲證	2014-166059	20160205	20340817	明	技術處
			生理量測的感測系統						發	經濟部
	23	P07020015US	與方法	US	獲證	14/335, 216	20180130	20331124	明	技術處
			人體器官的物理活動						發	經濟部
	24	P07940014CN	的監視裝置	CN	獲證	200610094068.6	20081231	20260621	明	技術處
			人體器官的物理活動						發	經濟部
	25	P07940014CND1	的獲取方法	CN	獲證	200810135752.3	20110112	20260621	明	技術處
			人體器官之物理活動							_
	26	P07940014DE	的監視裝置及其擷取	DE	獲證	EP06000082.5	20080709	20260102	發	經濟部
			方法						明	技術處
			人體器官之物理活動							_
	27	P07940014FR	的監視裝置及其擷取	FR	獲證	EP06000082.5	20080709	20260102	發	經濟部
11			方法						明	技術處
			人體器官之物理活動							
	28	P07940014GB	的監視裝置及其擷取	GB	獲證	EP06000082.5	20080709	20260102	發	經濟部
			方法						明	技術處
			人體器官之物理活動							
	29	P07940014IT	的監視裝置及其擷取	IT	獲證	EP06000082.5	20080709	20260102	發	經濟部
			方法						明	技術處
			人體器官之物理活動						發	經濟部
	30	P07940014TW	的監視裝置及其擷取	TW	獲證	94147473	20090211	20251229	明	技術處
				l					<u> </u>	



_		Research insti	tute		1	1	T	T	1	
			方法							
			非接觸式心肺活動監						JÝ.	伝 密 如
	31	P07950009CND1	視裝置及其信號的獲	CN	獲證	201210421977.1	20150729	20261221	發	經濟部
			取方法						明	技術處
			非接觸式心肺活動監						3 V	6- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-
	32	P07950009DE	視裝置及其訊號之擷	DE	獲證	EP07121959.6	20160518	20271129	發	經濟部
			取方法						明	技術處
			非接觸式心肺活動監						***	to the her
	33	P07950009FR	視裝置及其訊號之擷	FR	獲證	EP07121959.6	20160518	20271129	發	經濟部
1.0			取方法						明	技術處
12			非接觸式心肺活動監						ant.	
	34	P07950009GB	視裝置及其訊號之擷	GB	獲證	EP07121959.6	20160518	20271129	發	經濟部
			取方法						明	技術處
			非接觸式心肺活動監							
	35	P07950009TW	視裝置及其訊號之擷	TW	獲證	95146608	20120421	20261212	發	經濟部
			取方法						明	技術處
			非接觸式心肺活動監						***	to the her
	36	P07950009US	視裝置及其訊號之擷	US	獲證	11/954, 586	20131001	20310429	發	經濟部
			取方法						明	技術處
1.0	25	D0 50 50 00 0 MW	可量測生理參數之運	mw	alb 1-0	00140105	2012111	20271212	發	經濟部
13	37	P07950039TW	動導引方法	TW	獲證	96148165	20131111	20271216	明	技術處
	20	D05050000D	ad to be looked by the Republic	D.D.	مد خدر	FD00150000 4	00111100	20200210	發	經濟部
	38	P07970020DE	脈衝式超寬頻感測器	DE	獲證	EP09153223.4	20111123	20290218	明	技術處
	20	D050500000	and the bollowing the Royal and	CD.	مد خدر	FD00150000 4	00111100	20200210	發	經濟部
	39	P07970020GB	脈衝式超寬頻感測器	GB	獲證	EP09153223.4	20111123	20290218	明	技術處
	40	D050500001D	and the last and the last and	10	ade and	2000 20000	20120220	20200210	發	經濟部
14	40	P07970020JP	脈衝式超寬頻感測器	JP	獲證	2009-036332	20130329	20290218	明	技術處
	4.1	DOFO FOR COMMUNICA	脈衝式超寬頻感應器	mw	ade and	00110001	20120401	20200222	發	經濟部
	41	P07970020TWC1	及其方法	TW	獲證	98110064	20120401	20290326	明	技術處
			脈衝式超寬頻感應器						發	經濟部
	42	P07970020USC1	及其方法	US	獲證	14/802, 650	20180612	20291218	明	技術處
1.5		родосос	腸蠕動檢測裝置及其	***		10.10=0	201225::	202125-	發	經濟部
15	43	P07990011US	系統與方法	US	獲證	12/979, 536	20130514	20310707	明	技術處
		DOEC COST	量測人體生理參數之			00117-1-	201721	000015	發	經濟部
1.0	44	P07990013TW	方法	TW	獲證	99145712	20150101	20301223	明	技術處
16	4-	DO TO OCCA AND	量測人體生理參數之			10 (050 500	2012122	2021222	發	經濟部
	45	P07990013US	方法	US	獲證	12/979, 532	20121030	20310201	明	技術處
		D	利用脈衝電波之心血			0.5	001=-1	0077	發	經濟部
17	46	P07990017TW	管脈搏量測裝置及方	TW	獲證	99146439	20150811	20301227	明	技術處
	1	<u> </u>	<u>l</u>		1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	l	



Industrial Technology Research Institute

					(
					1
	`L				1
	\I				1
	14				1
					1

(二) 前瞻檢測

案	件	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	專利起期	專利迄期	類型	委辦 單位
18	47	P07000023TW	三維絕對座標偵測系 統、互動三維顯示系統以 及辨識物體之三維座標 的方法	TW	獲證	100149122	20141001	20311227	發明	經濟部 技術處
19	48	P07010024US	光學旋轉角度量測系統 及其方法	US	獲證	13/784, 947	20150317	20330304	發明	經濟部 技術處
20	49	P07010042TW	舒適度調控系統、其使用 者端設備及其系統端設 備	TW	獲證	101148706	20151211	20321219	發明	經濟部 技術處
20	50	P07010042US	舒適度調控系統、其使用 者端設備及其系統端設 備	US	獲證	13/889, 906	20170124	20340228	發明	經濟部 技術處
0.1	51	P07040011TW	多點光譜系統	TW	獲證	104140286	20170421	20351201	發明	經濟部 技術處
21	52	P07040011US	多點光譜系統	US	獲證	14/980, 532	20180417	20360725	發明	經濟部 技術處
22	53	P07060003EP	一種脈衝雷射裝置	EP	申請中	EP18181443.5	申請中	申請中	發明	經濟部 技術處
22	54	P07060003US	一種脈衝雷射裝置	US	獲證	15/643, 456	20190730	20370705	發明	經濟部 技術處
23	55	P07060008TW	磁性電容元件	TW	獲證	106136482	20190711	20371023	發明	經濟部 技術處
20	56	P07060008US	磁性電容元件	US	獲證	15/854, 360	20190611	20371225	發明	經濟部 技術處
24	57	P07060009TW	鎖模光纖雷射裝置	TW	獲證	107100772	20190201	20380108	發明	經濟部 技術處
<i>2</i> 4	58	P07060009US	鎖模光纖雷射裝置	US	獲證	15/840, 255	20190924	20371219	發明	經濟部 技術處
25	59	P07060010TW	光學測距方法及光相位 差檢測系統	TW	獲證	107100120	20190621	20380102	發明	經濟部 技術處
20	60	P07060010US	光學測距方法及光相位 差檢測系統	US	申請中	15/857, 216	申請中	申請中	發明	經濟部 技術處



Industrial Technology Research Institute

26	61	P07910025US	光均勻化顯微影像裝置	US	獲證	10/692, 754	20060207	20231026	發明	經濟部
20	01	10101002000		00	7文 匝	10/002, 104	20000201	20201020	38 71	技術處
	62	P07920036CN	電磁信號感測系統	CN	獲證	200410058224. 4	20080917	20240816	發明	經濟部
	02	1 0 1 9 2 0 0 0 C N	电燃后弧燃料系统	CN	授证	200410030224, 4	20000911	20240010	發 切	技術處
27	63	P07920036TW	電磁訊號感測系統	TW	獲證	92136919	20050111	20231224	發明	經濟部
41	บอ	FU19200301W	电磁机弧燃烧系统	1 W	授证	92130919	20030111	20231224	%"奶	技術處
	64	P07920036US	電磁訊號感測系統	US	獲證	10/936, 799	20060131	20240908	發明	經濟部
	04	10192003003	电燃机机燃燃料	US	授证	10/950, 199	20000131	20240900	% 切	技術處
28	65	P07990029TW	液體傳送裝置、生化檢測	TW	獲證	100119544	20140321	20310602	發明	經濟部
20	บอ	FU199UU291W	裝置與方法	1 W	授 證	100119344	20140021	20310002	%"明	技術處

(三) 軟性電子檢測

案	件	件編號	專利名稱	國	狀態	申請案號	專利起期	專利迄期	類型	委辨
711	,,	V)	7	家	,, 1,3	7 77 71 42	V 11/2/11	V 11 C/11	77.2	單位
	66	P07000006CN	電光調變裝置、電光檢	CN	獲證	201110365188.	20150603	20311110	發明	經濟部
29	00	1 0 10 00 00 0CN	測器及其檢測方法	CN	泛证	6	20130003	20311110	贺 切	技術處
25	67	P07000006TW	電光調變裝置、電光檢	TW	獲證	100132013	20150101	20310905	發明	經濟部
	07	L010000001W	測器及其檢測方法	1 W	授	100132013	20130101	20310903	贺"	技術處
	68	P07000012CN	圖像式彩色分析儀的	CM	43£ 24%	201110333769.	90150191	90911097	JÝ nD	經濟部
30 -	00	P07000012CN	校正方法及測量裝置	CN	獲證	1	20150121	20311027	發明	技術處
30	0.0	D070000107W	影像式彩色分析儀之	TDW	ن در الدر	100104700	00151011	00010000	7Ý nH	經濟部
	69	P07000012TW	校正方法及量測裝置	TW	獲證	100134769	20151211	20310926	發明	技術處
			影像信號選擇裝置、量							to his his
31	70	P07000032TW	測系統與立體影像量	TW	獲證	100148814	20140411	20311226	發明	經濟部
			測方法							技術處
			液晶單元特性測定裝			001010040010				1- \rightar +11
	71	P07000033CN	置以及液晶單元特性	CN	獲證	201210043918.	20160803	20320223	發明	經濟部
00			測定方法			5				技術處
32			液晶胞特性測定裝置							1- \rightar +11
	72	P07000033TW	以及液晶胞特性测定	TW	獲證	100147761	20150101	20311220	發明	經濟部
			方法							技術處
0.0	70	D0500000 455W	大動態範圍的電壓產	mw	ماد خادر	100140000	00150101	00011000	76 27	經濟部
33	73	P07000034TW	生器與電壓產生方法	TW	獲證	100148308	20150101	20311222	發明	技術處
			電光調制器的製造方			001010505050				to the hor
	74	P07010026CN	法及應用此方法製成	CN	獲證	201210585379.	20161102	20321227	發明	經濟部
34			的電光調制器			8				技術處
		D0=04000F	電光調制器的製造方			101110-05	001-001	0000101		經濟部
	75	P07010026TW	法及應用此方法製成	TW	獲證	101148590	20150911	20321219	發明	技術處



					I	T	I	I		1
			的電光調制器							
	76	P07010035CN	檢測裝置以及檢測方法	CN	獲證	201210581334.	20160413	20321226	發明	經濟部 技術處
35	77	P07010035TW	檢測裝置以及檢測方法	TW	獲證	101147993	20150321	20321217	發明	經濟部 技術處
	78	P07010035US	檢測裝置以及檢測方法	US	獲證	14/079, 568	20160607	20340924	發明	經濟部 技術處
0.0	79	P07020007CN	光電檢測系統	CN	獲證	201310583064. 4	20170825	20331117	發明	經濟部 技術處
36	80	P07020007TW	光電檢測系統	TW	獲證	102137250	20150121	20331015	發明	經濟部 技術處
	81	P07950020TW	面外位移特徵鑑別方 法及使用該方法之共 振頻率鑑別方法與裝 置	TW	獲證	95146516	20090701	20261211	發明	經濟部技術處
37	82	P07950020US	面外位移特徵鑑別方 法及使用該方法之共 振頻率鑑別方法與裝 置	US	獲證	11/987, 237	20100824	20290111	發明	經濟部技術處
	83	P07950020USD1	面外位移特徵鑑別方 法及使用該方法之共 振頻率鑑別方法與裝 置	US	獲證	12/837, 419	20111011	20271127	發明	經濟部技術處
	84	P07960006CN	影像調整方法及影像 擷取裝置	CN	獲證	200710130600. X	20110629	20270717	發明	經濟部 技術處
38	85	P07960006TW	影像調整方法及影像 擷取裝置	TW	獲證	96124430	20110201	20270704	發明	經濟部 技術處
30	86	P07960006US	影像調整方法及影像 擷取裝置	US	獲證	12/058, 926	20110823	20300622	發明	經濟部 技術處
	87	P07960006USD1	影像調整方法及影像 擷取裝置	US	獲證	13/177, 168	20120807	20280330	發明	經濟部 技術處
39	88	P07970019TW	振動位移與振動頻率 決定方法與其裝置	TW	獲證	97138634	20130201	20281007	發明	經濟部 技術處
υJ	89	P07970019US	振動位移與振動頻率 決定方法與其裝置	US	獲證	12/478, 847	20110913	20300408	發明	經濟部 技術處
40	90	P07980008TW	物質特性量測方法與 系統	TW	獲證	98139634	20131101	20291119	發明	經濟部 技術處
41	91	P07980011US	高動態範圍影像量測 方法與系統	US	獲證	12/840, 056	20121218	20310421	發明	經濟部 技術處



Industrial Technology Research Institute

42	92	P07980018TW	干涉相位差量測方法	TW	獲證	98142251	20131201	20291209	發明	經濟部
			及其系統							技術處
43	93	P07980028CN	建構高動態範圍圖像	CN	獲證	200910260156.	20130123	20291224	發明	經濟部
40	50	1 01300020CN	的系統及方法	CIV	7支 旺	2	20100120	20231224	3X -71	技術處
	94	P07980029CN	 對焦方法與裝置	CN	獲證	201010000539.	20121010	20300111	發明	經濟部
44	54	1 01900029CN	· 到 点 刀 仏 典 表 直	CN	授 超	9	20121010	20300111	贺 切	技術處
44	95	P07980029TW	對焦方法與裝置	TW	獲證	98144927	20140611	20291224	發明	經濟部
	อบ	1019000291#	到 無刀 公 四 衣 且	111	授 超	50144521	20140011	20231224	贺 切	技術處
	96	P07990008TW	基板電性的量測設備	TW	獲證	99125577	20140211	20300801	發明	經濟部
45	90	1019900001#	基 极电性的 里 例 政 佣	1 W	授 证	99120011	20140211	20300001	贺"	技術處
45	97	P07990008US	甘仁索从丛导测机供	US	獲證	12/981, 282	20131008	20320123	發明	經濟部
	91	10199000000	基板電性的量測設備	US	授 证	12/901, 202	20131000	20320123	贺"	技術處
	98	P07990022TW	建構高解析度影像之	TW	獲證	99144144	20140501	20301215	發明	經濟部
46	90	1019900221W	系統及方法	1 W	授 亚	JJ144144	20140501	20301213	%""约	技術處
40	99	P07990022US	建構高解析度影像之	US	x能 488	19/007 696	90191119	90911910	建	經濟部
	ยย	FU199UU22US	系統及方法	uS	獲證	13/087, 626	20131112	20311210	發明	技術處

(四)精微製程檢測

案	件	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	專利起期	專利迄期	類型	委辨
										單位
47	100	074900032TW	直餽式全數位之解調	TW	4th 200	00122000	00001001	00011007	JÝ nD	經濟部
41	100	0149000321W	裝置	1 W	獲證	90132969	20021221	20211227	發明	技術處
48	101	P07000022TW	光譜量測系統與光譜	TW	獲證	100141748	20140211	20311115	發明	經濟部
40	101	F010000221W	量測方法	1 W	授证	100141740	20140211	20311113	%"奶	技術處
49	102	P07000024TW	自動對焦裝置與方法	TW	獲證	100144606	20150121	20311204	發明	經濟部
49	102	F070000241W	日期到点农业兴力法	1 W	授证	100144000	20130121	20311204	%"号	技術處
50	103	P07000027TW	表面缺陷檢測裝置及	TW	獲證	100146063	20141101	20311212	發明	經濟部
50	105	P010000211W	其量測方法	1 W		100140000	20141101	20311212	發明	技術處
51	104	P07000037TW	具有可調範圍的非接	TW	獲證	100149610	20150211	20311228	發明	經濟部
91	104	FUIUUUUSIIW	觸式量測裝置	1 W	授证	100149010	20130211	20311220	%"奶	技術處
52	105	P07000038TW	自激振盪電磁耦合量	TW	獲證	100149589	20150101	20311228	發明	經濟部
92	105	F010000301W	測裝置	1 W	授证	100149309	20130101	20311220	%"号	技術處
			監測管理裝置、資料中							經濟部
53	106	P07000039TW	心的監測管理系統以	TW	獲證	100149123	20140321	20311227	發明	
			及監測管理方法							技術處
54	107	P07010001TW	自組式金屬奈米島陣	TW	准故	100135870	20140321	20311003	發明	經濟部
54	107	L010100011W	列之製作方法	1 W	獲證	100190010	20140021	20311003	贺明	技術處
55	108	P07010013US	自動對焦系統與自動	US	獲證	13/784, 640	20150210	20330917	水 四	經濟部
55	108	ru10100130S	對焦方法	0.5	獲證	13/184, 040	20100210	<u> </u>	發明	技術處



		escar CII IIIsti								
5.0	109	P07010030TW	工序分析監控系統及 其方法	TW	獲證	101149021	20150911	20321220	發明	經濟部 技術處
56	110	P07010030US	工序分析監控系統及 其方法	US	獲證	13/900, 905	20170404	20350323	發明	經濟部 技術處
	111	P07020006TW	人機共生安全監控系統及其方法	TW	獲證	102140914	20160901	20331110	發明	經濟部 技術處
57	112	P07020006US	人機共生安全監控系 統及其方法	US	獲證	14/224, 476	20160510	20340523	發明	經濟部 技術處
58	113	P07020008TW	多連桿旋轉機構	TW	獲證	102143871	20150301	20331128	發明	經濟部 技術處
	114	P07930010CN	一種待測物表面輪廓 分析方法	CN	獲證	200410064108.	20091014	20240818	發明	經濟部 技術處
59	115	P07930010TW	一種待測物表面輪廓 分析方法	TW	獲證	93124032	20050811	20240810	發明	經濟部 技術處
	116	P07930012CN	光譜影像測量裝置	CN	獲證	200410102831. 6	20090114	20241227	發明	經濟部 技術處
60	117	P07930012TW	光譜影像量測裝置	TW	獲證	93130696	20051211	20241010	發明	經濟部 技術處
	118	P07930012US	光譜影像量測裝置	US	獲證	11/147, 436	20080819	20260111	發明	經濟部 技術處
0.1	119	P07940030TW	高密度多通道檢測裝置	TW	獲證	95101406	20080101	20260112	發明	經濟部 技術處
61	120	P07940030US	高密度多通道檢測裝置	US	獲證	11/469, 904	20090224	20270524	發明	經濟部 技術處
	121	P07940035CN	多角度多通道檢測裝置	CN	獲證	200610135939. 4	20101229	20261016	發明	經濟部 技術處
62	122	P07940035TW	多角度多通道檢測裝置	TW	獲證	95129853	20090921	20260814	發明	經濟部 技術處
	123	P07940035US	多角度多通道檢測裝置	US	獲證	11/734, 794	20110111	20290625	發明	經濟部 技術處
	124	P07970022CN	三維形貌檢測裝置	CN	獲證	200810180153. 3	20110810	20281130	發明	經濟部 技術處
63	125	P07970022TW	三維形貌檢測裝置	TW	獲證	97145044	20130301	20281120	發明	經濟部 技術處
	126	P07970022US	三維形貌檢測系統	US	獲證	13/461, 898	20110726	20290509	發明	經濟部 技術處
64	127	P07970030TW	干涉儀訊號處理之方 法與裝置	TW	獲證	97145045	20130301	20281120	發明	經濟部 技術處
65	128	P07980003CN	利用光學偏振特性的	CN	獲證	201010105963.	20140507	20300124	發明	經濟部



		G1				*7		1		
		C1	三維顯微共焦測量系			X				技術處
			統與方法							
		P07980003TW	利用光學偏極特性之							經濟部
	129	C1	三維顯微共焦量測系	TW	獲證	98144926	20140211	20291224	發明	
		CI	統與方法							技術處
			利用光學偏極特性之							經濟部
	130	P07980003US	三維顯微共焦量測系	US	獲證	12/647, 903	20130409	20310215	發明	
			統與方法							技術處
66	131	P07990016TW	塑膠膜片之雙表面微	TW	獲證	99142749	20140221	20301207	發明	經濟部
00	101	L019900101M	結構成型機構及方法	1 W	授证	99142149	20140221	20301201	%"号	技術處
67	132	P07990021TW	r ku	TW	獲證	99135513	20150921	20301017	發明	經濟部
07	197	P019900211W	虚擬觸控輸入系統	1 W	 授證	99100010	20130921	20301017	發明	技術處
	133	P07990027CN	移動樣品形貌的測量	CN	獲證	201110009368.	20140219	20310111	發明	經濟部
	100	F01990021CN	方法及其裝置	CN	授证	0	20140219	20310111	%"奶	技術處
68	134	P07990027TW	移動樣品之形貌的量	TW	獲證	99146801	20140211	20301229	發明	經濟部
00	104	1019900211W	測方法及其裝置	1 W	/ 授昭	JJ14U0U1	20140211	20301229	%"切	技術處
	135	P07990027US	移動樣品之形貌的量	US	獲證	13/088, 069	20140218	20311220	發明	經濟部
	100	1 0 1 3 3 0 0 2 1 0 3	測方法及其裝置	US	/授证	13/ 000, 009	20140210	20311220	%"切	技術處